

圖 8-2 元件微縮考慮的重要電性參數行為。

## 8.2 SOI

## 8.2.1 SOI 基材的製作

這裡介紹 SOI 晶片若干製作方法中,一種簡稱為 SIMOX 的製程,其是利用氧離子對晶片進行深植入,以便在晶片的表面矽與主材質(Bulk)之間,製作一層用來做為隔離之用的絕緣——SiO₂。可分為兩個主要的步驟,首先我們將在經加熱的晶片上(約 600℃以上),把氧離子植入晶片裡。然後把晶片置於溫度高達 1300℃以上的環境下數小時,把經離子植入而遭破壞的晶片表面的矽結構,恢復成低缺陷濃度的單晶矽(Single Crystal Si),使深處植入的氧與矽鍵結成 SiO₂ 而形成 SOI 基材的製作。